

INDUCTIVE LOAD TESTER 負荷テスター

LVTG20Z

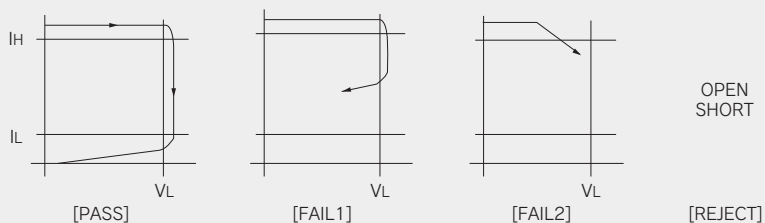
200V
200A

NEW

- LVTG20Z is designed to guarantee the energy limitation to switching at the inductive load of TRANSISTOR and MOS FETs by turn off waveform voltage and current area. This tester can measure the close tolerance of each points by the clamp voltage.
- LVTG20Zは、トランジスタ、MOS-FETのインダクタンス負荷時でのスイッチング動作に対する耐量を、ターンオフ波形の電流と電圧のエリアで保証する試験器です。クランプ電圧が装備されているため各耐圧での細かな耐量を調べることができます。

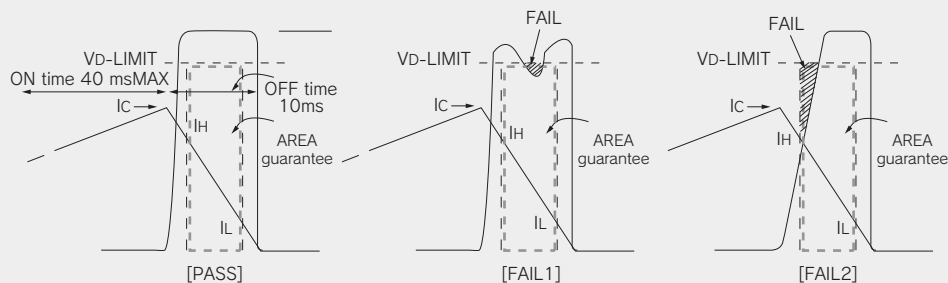


Fail Judge



- Measure and indicate $V_{sus}(V)$ to pass through I_H .
- I_H を通過するときの $V_{sus}(V)$ を測定し表示する。

- Judge it PASS more than V-GATE voltage in the current gate of the 2 points which are indicated with I_H and I_L .
- I_H と I_L で示される2点の電流ゲートの間でV-GATE電圧以上のものをPASSとする。



MODEL

LVTG20Z

SETTING RANGE

MEASURABLE DEVICES	NPN/PNP, N/P MOS-FET
$I_D/I_H/I_L$	0.20A~199A (3ranges)
VCL	1V~199V
IBF	$\pm 0.01A \sim \pm 2.00A$
IBR	$\mp 0.01A \sim \mp 2.00A$
VGF	$\pm 0.1V \sim \pm 39.9V$
VGR	$\mp 0.1V \sim \mp 39.9V$
VCLAMP/V LIMIT	10V~1999V
Rg	4 circuit select is possible

BINNING

BIN INDICATION	PASS, BV-FAIL, AREA-FAIL, REJECT(OPEN/SHORT)
----------------	--

DIMENSIONS & WEIGHT

MAIN UNIT	550(W)×875(D)×1100(H)…195kg
HEAD BOX	300(W)×770(D)×245(H)…24kg